

本功能使用Google Translate翻譯軟體，其翻譯結果僅供參考，本局不保證其翻譯結果之準確、完整或適用於特
目的。

This translation is machine-generated by using Google Translate. The translation is for reference
TIPO does not guarantee the translation is accurate, complete, reliable or fit for specific
purposes.

DTD版本：1.0.0

發明專利說明書

※申請案號：096106156

※IPC分類：

一、發明名稱：

專利品質參數權重評估方法

A METHOD FOR EVALUATING THE PARAMETER WEIGHTING FOR A PATENT

二、中文發明摘要：

本發明所提供之專利品質參數權重評估方法，係用以評估一專利評估式之權重值，且此該評估式中至少包括一參數值，此方法包括先標準化至少一專利之品質成績，而該專利係使用該評估式進行計算該品質成績，並以該至少一參數值以及該標準化品質成績計算該至少一參數值之對應權重。

三、英文發明摘要：

A method for evaluating the parameter weighting for a patent includes standardizing a quality value of a patent. The quality value is determined through a formula including a parameter at least. Based on the standardized quality value and the parameter value, the parameter weighting value is determined.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第1圖

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

101-102...步驟

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

六、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

[0001] 本發明係有關於一種評估權重方法，更特別是有關於一種專利各參數值權重之評估方法。

【先前技術】

[0002] 在知識經濟的時代中，企業保有競爭力的利器之一為專利建立、管理與應用。專利除可以使業者維繫其專屬之領域知識、避免受到競爭者模仿或侵犯之外，亦可透過專利銷售而創造收益。是故，在此產業發展趨勢下，如何評價一專利之品質實為產業經營的重要課題。

[0003] 傳統上公司在評估每一篇專利之品質時，會設定其所要評估之參數以及各參數之對應權重，並藉由累加每一參數值與其對應權重相乘後之數值來獲得一篇專利之品質成績。其中各參數值可由每一篇專利之公開資訊中獲得。

[0004] 然而，上述之方法中，用於評估一篇專利品質所使用之各參數權重，是由各公司自行設訂且涉及各公司之主觀認定，往往無一確切標準。

[0005] 因此，如何確切獲得一公司之主觀認定，及成為判定一專利在此公司重要性之關鍵點所在。

【發明內容】

[0006] 因此，本發明之主要目的就是在提供一種可進行專利評估式權重之分析方法。

[0007] 根據本發明所提供之專利品質參數權重評估方法，其係用以評估一專利評估式之權重值，且此該評估式中至少包括一參數值，此方法包括先標準化至少一專利之品質成績，而該專利係使用該評估式進行計算該品質成績，以及以該至少一參數值以及該標準化品質成績計算該至少一參數值之對應權重。

【實施方式】

[0008] 以下將以一實施例來說明本發明之應用，但本發明之應用不以下述之實施例為限。

[0009] 根據一實施例，假設一公司評估一專利品質成績時所考量之參數包括有，此專利被引用次數(ψ)、此專利之接續案數目(w)、專利之法律狀態(α)以及此專利於全球申請數(μ)等四項參數，而各參數對應之權重分別為

a1、a2、a3和a4。因此本發明之專利品質成績(Gs)評估式如下所示：

$$G_s = [a_1 \times f(\psi) + a_2 \times f(w) + a_3 \times f(\alpha) + a_4 \times f(\mu)] = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} [f(\psi) f(w) f(\alpha) f(\mu)] = AB \quad (1)$$

)

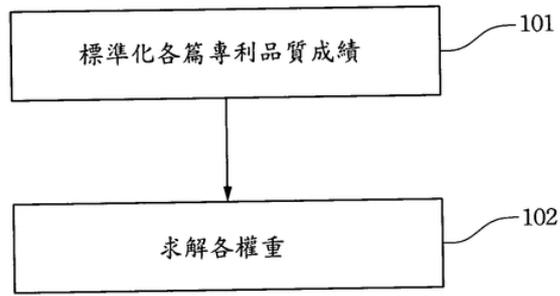
$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad B = [f(\psi) f(w) f(\alpha) f(\mu)]$$

- [0010] 其中被引用次數(ψ)係根據該篇專利被引用數來界定此篇專利之品質。專利之接續案數目(w)，係根據該篇專利之接續案數目來評估此篇專利之品質。專利之法律狀態(α)，係指此篇專利其專利權利狀態正受他人挑戰之狀態。專利於全球申請數(μ)，係根據一篇專利在全球各國提出申請之數目來評估此篇專利之品質。值得注意的是，上述之各參數值僅為一基本參數，本發明參數值權重評估方法並不僅限於僅評估上述參數之對應權重，例如亦可包括專利被轉讓次數、專利申請期間長短、專利於申請被駁回後之再次申請次數、專利授權家數等。
- [0011] 參閱第1圖所示即為本發明評估一專利評估式中各參數對應權重之流程圖。當一使用者知此公司評估一專利品質成績時所考量之參數，且具有數篇利用此公司評估式所計算出之品質乘積，卻不知此公司給予之對應權重時，其即可藉由本發明之方法，來獲得此公司所使用評估式各權重a1、a2、a3和a4之值時。首先於步驟101，標準化各篇專利之品質乘積，根據本實施例係將各篇利用此公司評估式所計算出之專利品質乘積設定為1，亦即將式(1)之Gs值設定為1。接著於步驟202，由於各參數值可從各公開資料獲得，因此為已知數，且品質乘積被設定為1，因此可對未知之各權重值a1、a2、a3和a4進行求解。在一實施例數中，可使用反矩陣之方式進行求解。如下所示：
- [0012] 根據式(1)，在已知Gs = AB，且Gs設定為1，B矩陣為已知的情況下，要求出A矩陣值時，可將方程式兩邊同時乘上B的反矩陣。亦即將方程式兩邊同時乘上B⁻¹使得Gs B⁻¹ = (AB)B⁻¹ = A(BB⁻¹) = UA = A
- [0013] 其中B⁻¹和B之乘積U稱為「單位矩陣」。任何矩陣和單位矩陣相乘均不會產生改變。而Gs設定為1，因此A矩陣值及等於B的反矩陣。
- [0014] 依此即可獲得各權重a1、a2、a3和a4之值。換言之，即可獲得此公司用以評估各篇專利所使用之評估式。因此亦可間接獲知，此公司在評估一篇專利之品質時，其所最重視之參數為何。例如若以上例而言，當計算出之各權重值間，以a1之值為最大即表示此公司在評估一篇專利之品質時，係認為此篇專利被引用次數之多寡，在專利品質之認定上最為重要。此外，各公司評估專利品質時，對同一篇專利之品質，即使在使用同樣評估參數下，仍可能會有不同之結果，此時藉由本發明之專利品質參數權重評估方法，即可確切獲知是什麼原因造成兩公司評估上之差異。另一方面，在專利之交易上，亦可藉由本發明之方法，先前獲知此公司對此篇專利品質之認定，藉以獲得公平之交易價格。
- [0015] 雖然本發明已以一較佳實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明，任何熟習此技藝者，在不脫離本發明之精神和範圍內，當可作各種之更動與潤飾，因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
- 【圖式簡單說明】
- [0017] 為讓本發明之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附圖式之詳細說明如下：第1圖所示即為本發明評估一專利評估式中各參數對應權重之流程圖。
- 【主要元件符號說明】
- [0016] 101~102...步驟

七、申請專利範圍：

1. 一種專利品質參數權重評估方法，係用以評估一專利評估式之權重值，其中該評估式中至少包括一參數值，至少包含：標準化至少一專利之品質成績，其中該專利係使用該評估式進行計算該品質成績，其中該評估式係由累加該至少一參數值與對應之權重相乘後所形成，其中計算該對應權重之方法更包括：形成一由該至少一參數值所形成矩陣之反矩陣；以及將該反矩陣與該標準化後之專利之品質成績相乘；以及以該至少一參數值以及該標準化品質成績計算該至少一參數值之對應權重，其中該參數至少包括由該專利被引用次數、該專利之接續案數目、該專利之法律狀態、該專利於全球申請數、該專利被轉讓次數、該專利申請期間長短、該專利於申請被駁回後之再次申請次數、該專利授權家數以及上述組合所組成之參數中，選擇其中之一。
2. 如申請專利範圍第1項所述之專利品質參數權重評估方法，其中該標準化至少一專利之品質成績係指將該品質成績設定為1。

八、圖式：



第 1 圖

第1圖